

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Record Nr.           | UNISA996216631503316  |
| Titolo                  | VTS 2008 : proceedings : 26th IEEE VLSI Test Symposium : San Diego, California, 27 April - 1 May 2008 |
| Pubbl/distr/stampa      | New York : , : IEEE, , 2008   |
| ISBN                    | 1-5090-8176-3   |
| Descrizione fisica      | 1 online resource (xxx, 413 pages)  |
| Soggetti                | Integrated circuits - Very large scale integration - Testing  |
| Lingua di pubblicazione | Inglese   |
| Formato                 | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico   | Monografia  |